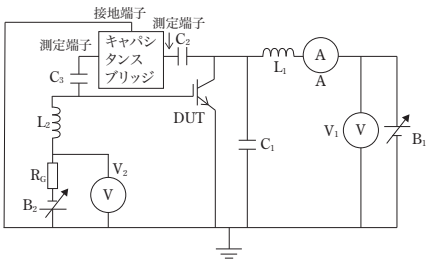
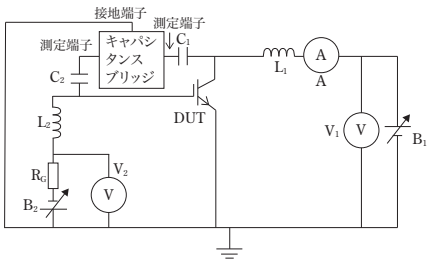
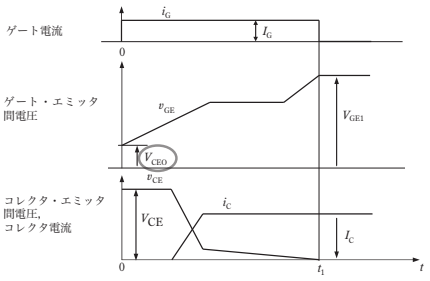
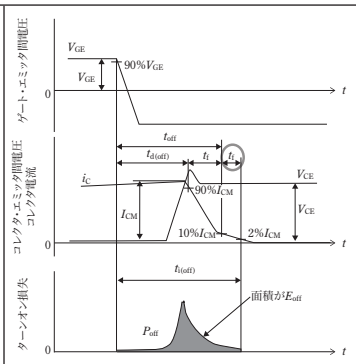
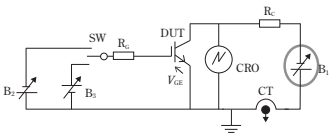
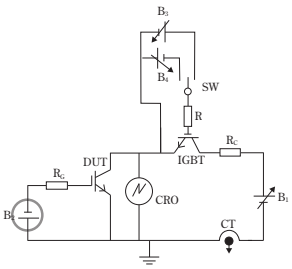
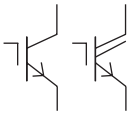
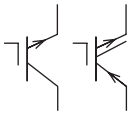
電気学会 電気規格調査会標準規格

JEC-2405:2015 正誤票 -1

絶縁ゲートバイポーラトランジスタ

発行日：2017 年 10 月 2 日

項番	ページ	箇 所	誤	正
1	19	注 d)	IEC 60747-9:2007 の 6.3. Table 1	IEC 60747-9:2007 の 6.2. Table 1
2	21	図 5	(iii) V_{GER}	(i) V_{GER}
3	22	図 7	B：コレクタ電流供給用可変定電圧電源	B_1：コレクタ電流供給用可変定電圧電源
4	25	図 11	B_1：コレクタ損失供給用可変定電圧電源	B_1：コレクタ電流供給用可変定電圧電源
5	28	3.2)	指定の電圧，又は指定の電圧･周波数･デューティのパルス	指定の電圧 (，又は指定の電圧・周波数・デューティのパルスの文章削除)
6	29	3.2)	指定の電圧，又は指定の電圧･周波数･デューティのパルス	指定の電圧・周波数・デューティのパルス (指定の電圧，又はの文章削除)
7	33	図 21		 C_1 → 削除 C_2 → C_1 C_3 → C_2
			C_1，C_2，C_3：測定用コンデンサ	C_1，C_2：測定用コンデンサ
8	35	図 24	 V_{CEO}	V_{GE0}

9	40	図 29	 t_f	t_t
10	40	c) 手順 2 行目	制限用抵抗を通して電源 B_2 によってコレクタ・エミッタ間電圧（逆バイアス）を指定の値に設定する。	制限用抵抗を通して電源 B_2 によってゲート・エミッタ間電圧（逆バイアス）を指定の値に設定する。
11	44	1 行目 2 行目	3.2）試験方法 加熱法又は冷却法	削除
12	44	3 行目	3.3) 基準点温度測定点	3.2) 基準点温度測定点
13	44	5 行目	3.4) 冷却方式及び冷却条件	3.3) 冷却方式及び冷却条件
14	45	3 行目	3.2）試験方法　　加熱法又は冷却法	削除
15	45	4 行目	3.3) 基準点温度測定点	3.2) 基準点温度測定点
16	45	5 行目	3.4) 冷却方式及び冷却条件	3.3) 冷却方式及び冷却条件
17	47	図 37		
18	49	図 39 各記号 説明	B_2：負のゲート・エミッタ間直流電源	B_2：正のゲート・エミッタ間直流電源
19	49	図 39		
20	49	c) 手順	1) 供試 IGBT（DUT）のゲート・エミッタ間に指定の逆バイアス電圧 B_2 を印加する。	1) 供試 IGBT（DUT）のゲート・エミッタ間に指定の順バイアス電圧 B_2 を印加する。
21	55	注記	この試験では，5.5.2 と同様の	この試験では，6.5.2 と同様の
22	63	表 F.1